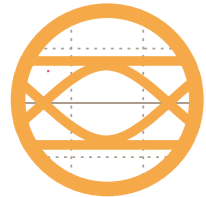


100G和400G设计测试可能会让人望而生畏

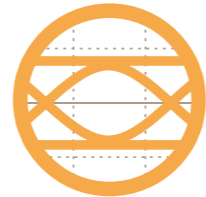
测试挑战

测试解决方案



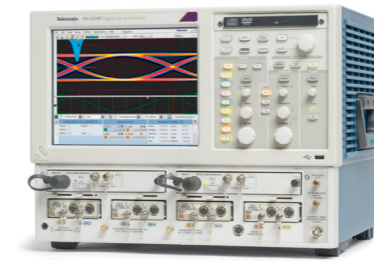
眼图分析

- 4 x 25G电接口和光接口发射机眼图



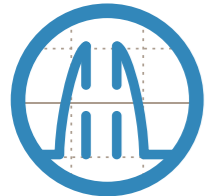
眼图分析

- 高精度分解噪声和抖动成分
- 定时余量小
- 高频时钟和数据



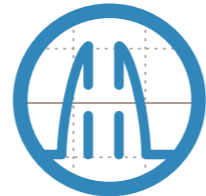
DSA8300采样示波器

- >70GHz带宽
- <100 fsec系统抖动噪声
- 通过/失败测试, 高吞吐量
- 基于BUJ的抖动分析和测试自动化
- 测试自动化



BER轮廓

- 4 x 25G电接口和光接口接收机BER检定



BER轮廓

- 为DFE检定生成复杂的损伤
- 并行拓扑, 有串扰
- 长码型 (PRBS-31)

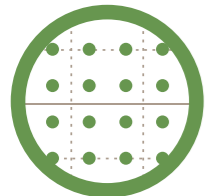


BSA286C误码率测试仪

- 28.6 Gb/sec, 低固有抖动
- 误码位置和抖动分析
- 32Gb/sec信号调节/均衡

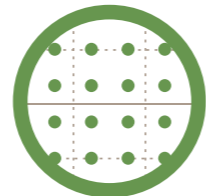
PPG/PED多路误码率测试仪

- 最多4条32Gb/s PG通道
- 40Gb/s误码检测



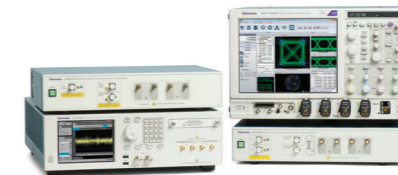
复杂调制

- 分析100G和400G复杂调制



复杂调制

- I-Q支路模糊分辨率
- 生成相干光学信号
- 不同的400G超级通道配置



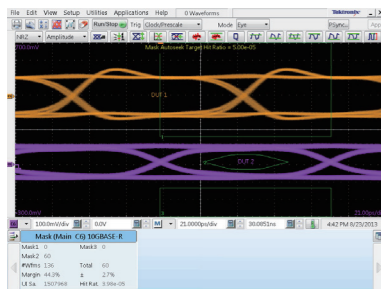
相干光学解决方案

- 相干信号生成和光学调制
- PM-QPSK和PM-QAM分析
- 适用于实时示波器或等效时间示波器
- 400G+多载波超级通道分析

泰克拥有您需要的专业知识

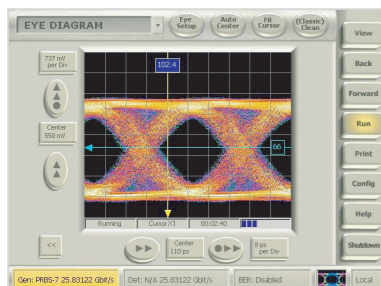
亲眼见证: www.tektronix.com/100G

在设计测试失败时提供更深入的洞察力



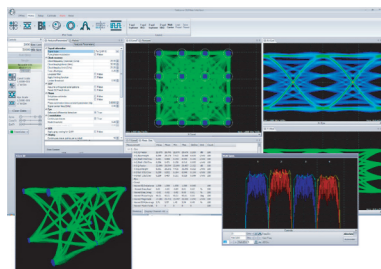
完善的抖动和定时分析

- 支持100G标准
- 模板测试，自动测试通过/失败功能
- 分离有界不相关抖动和噪声(BUJ/BUN)
- 同时测试多条通道



接收机测试，支持复杂损伤

- 低固有噪声，改善测试余量
- 精确的误码位置分析
- 垂直和水平BER分解
- 全面的测量报告



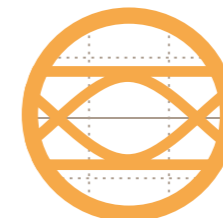
相干光学信号分析

- 全面支持EVM、BER和Q曲线
- 实时Matlab整合
- 400G+多载波超级通道频谱
- 3D星座图/眼图
- 相干信号生成>28Gbaud

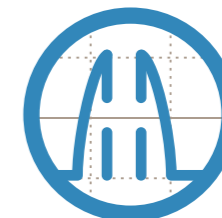
100G推荐测试设备

标准	吞吐量 (Gb/sec)	测试要求	推荐泰克设备
OIF CEI-28G VSR	28.05	发射机，电接口接收机	DSA8300及80E10、LE320、BSA286C
100GBASE-LR4, SR4, OTU-4	4 x 25.781 4 x 27.95	电接口发射机 光接口发射机 电接口接收机 4 x 25G端到端BER	DSA8300及80E10 DSA8300及80C15、LE320、BSA286C PPG3204及PED3202
OIF DP-QPSK	4 X 32	光学调制和BER 光学信号生成 码型生成	OM4106D及DPO73304DX OM5110及AWG70001A PPG3204

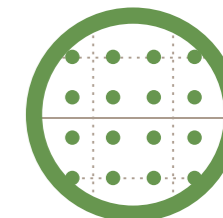
100G测试洞察力和专业知识



眼图分析



BER轮廓



复杂调制

产品技术资料
应用指南
操作视频
免费海报及其它!

解决100G测试挑战

登录www.tektronix.com/100G